



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



بررسی دوران فارادی در یک بلور فوتونیک مغناطیسی دارای کاواک نقص

ملیحه حسام الدینی^۱، تهمنه جلالی^۲ و فاطمه پارسایی^۳

گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ۷۵۱۶۹

چکیده - در این مقاله بلورهای فوتونیک مغناطیسی، خواص مغناطوآپتیکی شان به همراه ایجاد نقص در ساختار آنها معرفی می‌گردد. معادلات ریاضی لازم برای کمیت‌های مغناطوآپتیکی و معادلات الکترومغناطیسی حاکم بر آنها بیان می‌شود. شبیه‌سازی یک برهه بلور فوتونیک مغناطیسی بس‌لایه‌ای کاواک گونه که دارای ساختار متناوب به صورت $(MG)^4(M)(GM)^4$ است، بر پایه روش المان متناهی انجام می‌شود که M ماده مغناطیسی فعال و G ماده غیر مغناطیسی است. میدان‌های الکتریکی انتشار یافته در ساختار بس‌لایه‌ای در بازه بسامدی امواج مرئی نشان داده شده است و در نهایت میزان عبور دوران فارادی را نشان می‌دهیم.

کلید واژه - بلور فوتونیک مغناطیسی، روش المان متناهی، دوران فارادی، فیلم بس‌لایه‌ای

Faraday rotation in a Cavity-type Multilayered Magnetic Photonic Crystal

Maliheh Hesamodini¹; Tahmineh Jalali², Fatemeh Parsae³

Abstract-In this paper, magnetic photonic crystals is investigated by their magneto-optical properties and interroducing defects to the structure. Physical relations and electromagnetic equations are proposed. A cavity-type 1-D magnetic photonic crystal which has a structure of $(MG)^4(M)(GM)^4$ is simulated based on a finite element method and M is an active magnetic material and G is dielectric. Electric field profile is shown in optical regim and finally Faraday rotation is calculated and analyzed.

Keywords: Magnetic photonic crystals, finite element method, Faraday rotation, Magnetic thin film.

۱- مقدمه

امروزه بلورهای فوتونیک از مباحث علمی مورد توجه بسیاری از محققان است، که کاربردهای وسیعی را در حوزه پژوهش‌های بنیادی و تکنولوژی یافته است. بلورهای فوتونیک، آرایه تناوبی از مواد دی‌الکتریک هستند. این بلورها دارای گاف‌های نواری فوتونیک می‌باشند که از انتشار نور در جهات مشخص با انرژی‌های معین جلوگیری می‌کنند. این انقلاب فناوری، توانایی ما را برای کنترل انتشار نور به همراه دارد [۱]. مهمترین مشخصه این مواد داشتن گاف‌های نواری فوتونیک است که در این بسامدها، نور قادر به عبور از ماده نیست. این ویژگی سبب می‌شود که با تعریف نقص‌های نقطه‌ای و خطی مناسب بتوان در محدوده بسامدهای ممنوعه امواج الکترومغناطیسی را درون یک ساختار بلور فوتونیک به دام انداخت و به این ترتیب به روش جدیدی برای کنترل و هدایت نور دست یافت [۲]. با ایجاد نقص‌های نقطه‌ای یا خطی می‌توان مدهای خاصی را در گاف نواری بلور به وجود آورد که قابل کنترل می‌باشند و مبنای کاربرد در بسیاری از ابزارها چون لیزرهای میکروکاواک، دیودهای گسیلنده نور و غیره است [۳]. در این مقاله، نخست بلورهای فوتونیک مغناطیسی به همراه ایجاد نقص در ساختار آن‌ها معرفی می‌گردد و سپس چیدمان شبیه‌سازی ارائه می‌گردد. در نهایت میزان عبور نورانی را نشان می‌دهیم.

۲- بلورهای فوتونیک مغناطیسی (MPC)

تنظیم‌پذیری خواص اپتیکی بلورهای فوتونیک باعث کاربردهای جدیدی از این مواد در ادوات مدار مجتمع نوری می‌شود. تنظیم‌پذیری در مواد نیم‌رسانا با تغییر دما یا ولتاژ انجام می‌شود. از راه‌های دیگر کاربرد فشار الاستیکی، تزریق بلور مایع، به کار بردن میدان مغناطیسی خارجی یا استفاده از قطعات مغناطیسی است. دو روش آخر بسیار قابل توجه است، زیرا خود باعث پدیده‌های جدید و جالب توجه مغناطوپتیکی نیز می‌شوند. وقتی مواد تشکیل‌دهنده بلورهای فوتونیک دی‌الکتریک‌هایی دارای خاصیت مغناطیسی باشد یا نقصی که در ساختار بوجود می‌آید خاصیت مغناطیسی داشته باشد، در نتیجه

آن ساختار پاسخ‌های اپتیکی و مغناطوپتیکی منحصر بفردی از خود نشان می‌دهد. از این به بعد چنین ساختاری را بلور فوتونیک مغناطیسی می‌نامیم. در چنین حالتی با تابش میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی، اجزای مغناطیسی ماده دچار مغناطش می‌گردند و خواص مغناطوپتیکی منحصر بفردی از خود نشان می‌دهند. پژوهش‌های نظری بر روی MPCها از سال ۱۹۹۵ با بررسی آرایه‌های یک بعدی بس‌لایه‌ای که شامل لایه‌های نازکی از SiO_2 در کنار ماده مغناطیسی Bi:YIG بودند آغاز شد [۳]. این لایه‌ها به صورت تصادفی در کنار هم قرار گرفته بودند. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که خواص مغناطوپتیکی از جمله دوران فارادی در این ساختار نسبت به مواد مغناطیسی همگن افزایش قابل توجهی دارد [۴]. هم چنین با توجه به ابعاد بسیار کوچک این ساختارها، آن‌ها نوید بخش رده‌ی جدیدی از قطعات مغناطیسی در ابزارهای مدار مجتمع نوری محسوب می‌گردند.

۳- نقص در بلور فوتونیک یک بعدی

نقص در بلور فوتونیک یک بعدی می‌تواند با تغییر در ابعاد و یا جنس ماده‌ی دی‌الکتریک در یکی از لایه‌های نازک به وجود آید. این کار باعث می‌شود که تقارن انتقالی در راستای متناوب شکسته شود. اما در سایر نقاط بلور که از محل نقص دور است، می‌توان انتظار داشت که تقارن انتقالی و ساختار نواری و گاف نواری به شکل قبل باقی بماند، اما در محل نقص این ویژگی‌ها دیگر وجود ندارد. پس این فرض ممکن است که برخی بسامدهای ممنوع گاف نواری حالا بتوانند در محل نقص منتشر شود، در حالی که هم‌چنان در نقاط دیگر بلور دور از محل نقص اجازه انتشار ندارند. این حالت می‌تواند باعث محبوس شدن مد با بسامدی از محدوده گاف نواری در محل نقص شود که اصطلاحاً به آن مد جایگزیده می‌گویند. از این روش در ساخت کاواک‌های بلور فوتونیک مغناطیسی یک بعدی استفاده می‌شود.

۴- شبیه سازی در محیط کامسول ۴.۳

کامسول یک بسته نرم‌افزاری است که بر پایه معادلات دیفرانسیل جزئی طراحی گردیده است. در این نرم افزار

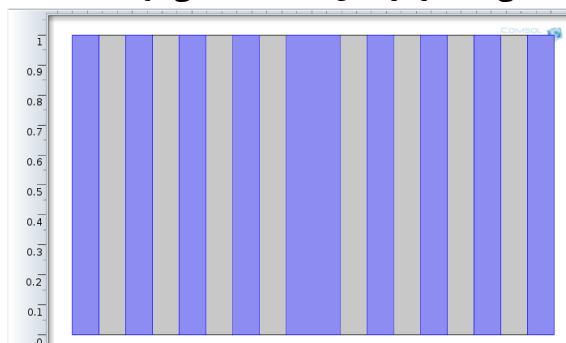
ثابت به خواص ذاتی محیط، بسامد نور تابشی و دمای محیط بستگی دارد.

۶- چیدمان شبیه سازی

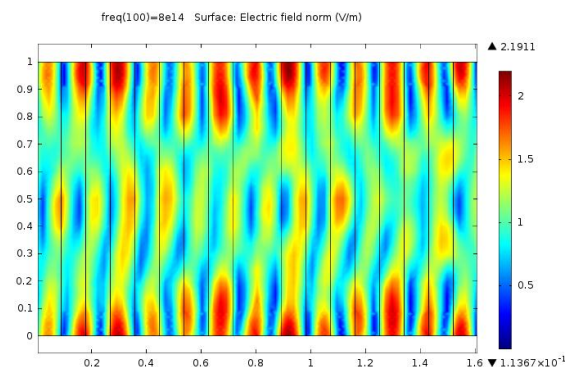
در این مقاله، بلور فوتونیک که به صورت ساختار لایه نازک بس لایه ای متشکل از لایه های مغناطیسی و غیرمغناطیسی است در محیط کامسول شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار می گیرد. این ساختار آرایه ای متناوب به صورت $(GM)(M)(MG)^4$ است که در آن G ماده دی-الکتریکی CaF_2 با ضریب شکست $n=1.42$ و M ماده فعال مغناطیسی CeF_3 با ضریب شکست $n=1.62$ می باشد. تانسور گذردهی آن به صورت زیر می باشد [۸]:

$$\begin{pmatrix} 2.6244 & 0 & 0 \\ 0 & 2.6244 & -1.3122 \times 10^{-6}i \\ 0 & 1.3122 \times 10^{-6}i & 2.6244 \end{pmatrix} \quad (4)$$

در این آرایه ضخامت لایه دی الکتریکی $89.4nm$ و ضخامت لایه مغناطیسی $89.5nm$ می باشد. این آرایه در فضای محاسباتی دوبعدی رسم شده است نمای هندسی ساختار در شکل (۱) مشاهده می شود.



شکل (۱)-ساختار MPC مربوط به نقص در فیلم بس- لایه ای در فضای محاسباتی دوبعدی



شکل (۲)- شبیه سازی میدان الکترومغناطیسی در محیط کامسول

مسائل شناخته شده در زمینه هایی هم چون الکترومغناطیس، ژئوفیزیک، انتقال حرارت، مکانیک کوانتوم و غیره که به روش تقریبی معادلات دیفرانسیل جزئی حل می گردند براساس ویژگی هایی هم چون خطی یا غیر خطی بودن یا غیره طبقه بندی شده و توصیف می گردند. با وجود این مدل های از خصوصیات چگون خواص مواد، قیدها، چشمه و شار و تعریف شرایط مرزی توسط کاربر، نرم افزار مسئله را بر پایه روش المان متناهی به صورت داخلی اجرا کرده و حل می کند، که با توجه به شرایط مرزی:

$$n \times E = 0 \quad (1)$$

$$S = \frac{\int_{\partial\Omega} E \cdot E_1}{\int_{\partial\Omega} E_1 \cdot E_1} \quad (2)$$

این میدان های شبیه سازی شده از طرف نرم افزار می تواند در قالب برنامه ای به زبان MATLAB ارائه گردد. این برنامه سپس می تواند در محاسبه ی سایر کمیت های فیزیکی مورد نظر ما که با شناخت امواج الکترومغناطیسی در سیستم میسر می شود، به کار رود که از جمله آن می توان به محاسبه طیف عبور امواج یا خواص مغناطیسی و ... اشاره کرد.

۵- دوران فارادی

در سال ۱۸۵۴ مایکل فارادی کشف کرد که وقتی یک قطعه شیشه ی معمولی در معرض میدان مغناطیسی خارجی قرار بگیرد و نور قطبیده ی خطی در راستای جهت میدان مغناطیسی به آن تابیده شود، صفحه ی قطبش نور عبور یافته نسبت به نور فرودی به اندازه ی زاویه ی θ چرخیده است؛ فارادی میزان این چرخش را به صورت زیر اندازه گیری کرد [۷]:

$$\theta = V_m H L \quad (3)$$

H اندازه ی میدان مغناطیسی، L مسافت طی شده توسط نور در ماده و V_m ثابت ورده نامیده می شود که میزان چرخش صفحه ی قطبش نور در واحد طول مسیر طی شده توسط نور در ماده در واحد میدان مغناطیسی است. این

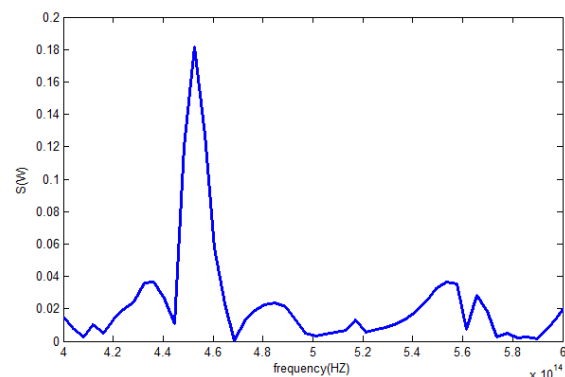
نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی بلور فوتونیک مغناطیسی یک بعدی با ایجاد نقص در ساختار مغناطیسی آن می‌پردازیم. شبیه‌سازی با روش المان متناهی استفاده از نرم‌افزار کامسول انجام شده است. برای پیدا کردن نتایج شبیه‌سازی از خواص فیزیکی ساختار استفاده شده است و شرایط مرزی مناسب را برای اعمال موج تخت به ساختار قرار داده‌ایم. نتایج شبیه‌سازی و محاسبه دوران فارادی نشان می‌دهد که ایجاد نقص باعث افزایش دوران فارادی تا چند برابر در گاف نواری ساختار می‌شود.

مراجع

- [۱] جان جوناپلوس، رابرت مید، د. وین، ن. جوشا، بلورهای فوتونیک قالبی برای شارش نور، موسسه انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۶.
- [۲] 28. Fan, S., Yanik, M. F., Wang, Z., Sandhu, S., Povinell, M. L. "Advances in theory of photonic crystals." Journal of Lightwave Technology., vol. 24, 2006.
- [۳] Krauss, T. F., DeLaRue, R. M. "Two-dimensional photonic bandgap structure." Nature, vol. 383, ۱۹۹۶.
- [4] Inoue, M., Fujii, T. "A theoretical analysis of magneto-optical Faraday effect of YIG films with random multilayer structure." J. Appl. Phys., vol. 81, ۱۹۹۷.
- [5] Sakoda, K. Optical Properties of Photonic Crystals. Berlin: Springer, 2001.
- [6] Levy, M., Jalali, A. A. "Band structure and Bloch states in Birefringent one-dimensional magneto-photonic crystals: An analytical approach." J. Opt. Soc. Am. B., vol. 24, 2007.
- [7] Zvezdin. A.K, Kotov. V. A, Modern Magneto-optics and Magneto-optical Materials, IOP Publishing, 1997.

با شبیه‌سازی این مدل می‌توان در نتیجه آن برهم‌کنش ماده با موج الکترومغناطیسی فرودی را بدست آورد. هدف از این کار تعیین میزان چرخش صفحه قطبش امواج الکترومغناطیسی است که از محیط عبور کرده‌اند و بیانگر چرخش فارادی مغناطواینتیکی می‌باشد. ما برای این کار روی مرز عبوری و خروجی شکل (۱) مقدار میدان الکتریکی و مغناطیسی را برای هر سه مولفه x, y, z بدست می‌آوریم و با برنامه نویسی در محیط مطلب می‌توان چرخش فارادی را به دست آورد.



شکل (۳) - میزان دوران فارادی در ساختار MPC دو بعدی

شکل (۳) نمودار دوران فارادی در این ساختار را در محدوده اپتیکی با بسامدهای 6×10^{14} تا 4.5×10^{14} نشان می‌دهد. ویژگی بارز این نمودار وجود یک قله تیز در بسامد 6.4×10^{14} است در حالی که در بقیه طیف بسامدی مقدار چرخش فارادی نزدیک به صفر است. چون این ساختار دارای کاواک مرکزی است یعنی نقصی در میان دو ساختار بس‌لایه‌ای قرار گرفته است، طبق پیش‌بینی‌های تئوری انتظار می‌رود یکی از بسامدهای گاف نواری را برانگیخته کند که در نتیجه آن خواص اپتیکی یا مغناطواینتیکی در آن بسامد نسبت به بسامدهای دیگر افزایش چند برابر از خود نشان می‌دهد. در این جا نیز میزان چرخش فارادی در بسامد 6.4×10^{14} که در محدوده گاف نواری قرار گرفته است نسبت به بسامدهای دیگر تقریباً ۹ برابر افزایش یافته است و به مقدار 0.18 درجه رسیده است. می‌توان گفت این ساختار برای چرخاندن صفحه قطبش امواج الکترومغناطیسی با بسامد 6.4×10^{14} کارآیی دارد.